

ВАК:

Карташов Д. А., Герасименко Н. Н., Медетов Н. А., Турьянский А. Г., Цехош В. И. Эффективность генетического алгоритма при анализе данных рентгеновской рефлектометрии. // Известия Высших Учебных Заведений: Электроника.- 2010.- №3 (83).- С. 74-79. Kartashov D. A., Gerasimenko N. N., Medetov N. A., Turyansky A. G. and Tsekhosh V. I. Performance of the Genetic Algorithm in X-ray Reflectometry Data Analysis // Russian Microelectronics.-2011.-Vol. 40.-No. 7.-pp. 526–528

Карташов Д. А., Медетов Н. А., Смирнов Д. И., Орлов Р. С., Иващенко О. В. Повышение эффективности вычислений результатов двухволновой рентгеновской рефлектометрии многослойных структур при использовании графических процессоров и технологии CUDA //“Труды МАИ”.- 2010.- № 40-15.

Карташов Д. А., Медетов Н. А., Смирнов Д.И., Орлов Р. С. Влияние предварительного преобразования экспериментальных данных на точность обработки рентгеновских рефлектограмм // Известия ВУЗов: Электроника.- 2011г.- №3 (89).- С. 83-88. Kartashov D. A., Medetov N. A., Smirnov D. I., Orlov R. S. Influence of the preliminary transformation of experimental data on precision of X-Ray data processing. // Russian Microelectronics.- 2012.-Vol. 41.-No. 7.

Г.Я. Красников, В.В. Бардушкин, Д.А. Карташов, Ю.И. Шиляева, В.Б. Яковлев. Влияние структуры и термоупругих характеристик компонентов на средние напряжения в анодном оксиде алюминия с нитевидными порами, заполненными поливинилиденфторидом // Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника – М.: 2017. – № 2 (166) – С. 45 – 50.

Г. Я. Красников, В. В. Бардушкин, Д. А. Карташов, А. А. Кочетыгов, Ю. И. Шиляева, В. Б. Яковлев. Эффективные упругие характеристики анодного оксида алюминия с нитевидными порами, заполненными поливинилиденфторидом // Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника – М.: 2018. – № 1 (169) – С. 59 – 63.

Бардушкин В.В., Сычев А.П., Карташов Д.А. Моделирование эффективных упругих характеристик и параметров анизотропии фрикционных полимерных композитов, армированных ориентированными волокнами // Полимерные материалы и технологии. 2019. Т. 5. № 3. С. 42–47. DOI: 10.32864/polymmattech-2019-5-3-42-48

Колесников В.И., Бардушкин В.В., Сычев А.П., Карташов Д.А. Концентрация напряжений в волокнистых полимерных композитах фрикционного назначения // Вестник РГУПС. 2020. № 1. С. 15–24.

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ:

Герасименко Н. Н., Карташов Д. А. Программный комплекс автоматизированной оценки параметров наноструктур по результатам рентгенооптических измерений, регистрационный № 2010610386 (заявка № 2009616133, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 11 января 2010 года).

Герасименко Н. Н., Карташов Д. А., Медетов Н. А., Орлов Р. С. Программа расчёта рентгеновских рефлектограмм на видеокартах NVidia с технологией CUDA, регистрационный № 2010615187 (заявка № 2010613431, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 11 августа 2010 года).

РИНЦ, тезисы конференций и круглых столов, не РИНЦ:

Карташов Д. А. Сравнение точности обработки результатов, полученных методом одноволновой и двухволновой рентгеновской рефлектометрии: сборник тезисов докладов научной конференции “Микроэлектроника и Информатика - 2009”.-Зеленоград, 2009.- С. 131.

Gerasimenko N. N., Kartashov D. A., Medetov N. A. Genetic algorithm, bees algorithm and extended bees algorithm efficiency comparison for X-Ray reflectogram decoding application // Eurasian physical technical journal: Modeling of nonlinear physical processes.- 2010. - vol. 7.- № 1(13).- P. 51-55.

Карташов Д. А. Анализ эффективности применения расширенного алгоритма пчёл и модификаций генетического алгоритма для быстрой компьютерной обработки рентгеновских рефлектограмм: Тезисы докладов конференции ВНКФ-16.- 2010.- С. 663.

Gerasimenko N. N., Kartashov D. A., Touryanski A. G. Development of computer methods for multi nano-layer parameters measurements by X-Ray reflectometry, Thesis of the conference The International Conference “Micro- and nanoelectronics – 2009” (ICMNE – 2009) including extended Session “Quantum Informatics” (QI-2009).- Zvenigorod, 2009.-ОЗ-27.

Карташов Д. А. Сравнение эффективности генетического алгоритма и гибридных алгоритмов на основе генетического для расшифровки рентгеновских рефлектограмм: Тезисы докладов конференции “Микроэлектроника и Информатика - 2010”.- Зеленоград, 2010.- С. 9;

Герасименко Н. Н., Карташов Д. А. Сравнение эффективности применения генетического алгоритма и гибридных алгоритмов на его основе для расшифровки рентгеновских рефлектограмм, полученных от многослойных наноструктур, выращенных на кремнии: Тезисы докладов конференции “Кремний - 2010”.- Нижний Новгород, 2010, С. 244;

Карташов Д. А., Медетов Н. А., Орлов Р. С. Компьютерные методы обработки результатов рентгеновских измерений параметров наноструктур: Тезисы докладов конференции “Нанотехнологии - 2010”.- Дивногорское, 2010.- С. 242;

Карташов Д. А., Медетов Н. А., Смирнов Д. И., Орлов Р. С. Обработка результатов рентгеновской рефлектометрии многослойных структур с реализацией параллельных вычислений на графических процессорах: Материалы 7-й международной научной конференции «Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент».- Караганда.- Казахстан, 2010г. – С.131-136.

Карташов Д. А., Медетов Н. А., Орлов Р. С. Компьютерные методы обработки результатов рентгеновских измерений параметров наноструктур: Тезисы докладов конференции “Физические и физико-химические основы ионной имплантации - 2010”.- Нижний Новгород.- 2010 г;

Карташов Д. А., Медетов Н. А., Орлов Р. С. Реализация параллельных вычислений по технологии CUDA для обработки результатов относительной двухволновой рентгеновской рефлектометрии многослойных структур // Вестник науки Костанайского социально-технического университета им. З.Алдамжар. – 2010. – №3. – с.279-287.

Карташов Д. А., Медетов Н. А., Смирнов Д. И., Орлов Р. С. Увеличение производительности компьютерных вычислений рентгеновских рефлектограмм // Вестник Карагандинского государственного университета.– Серия «Физика».- 2010. – №4(60). – с.72-78.

Карташов Д. А. Измерение толщины металлических слоёв в микроэлектромеханической мультиэлектродной биоматрице методом относительной двухволновой рентгеновской

рефлектометрии //Тезисы докладов III окружной научно-технической конференции молодых учёных и специалистов при префектуре ЗелАО г. Москвы. Москва, Зеленоград.- 2011.- с.18

Карташов Д. А. Методика численной оценки параметров интерфейса Si/SiO₂ на основе данных относительной рентгеновской рефлектометрии. //Тезисы докладов X-й Всероссийской научно-технической конференции молодых специалистов "Твердотельная электроника, сложные функциональные блоки РЭА", Дубна, 2011г.- с. 186-188;

Карташов Д. А. Измерение электрического сопротивления металлических слоёв в микроэлектромеханической мультиэлектродной биоматрице методом относительной двухволновой рентгеновской рефлектометрии //Тезисы докладов II Международной научно-технической конференции "Технологии микро- и нанoeлектроники в микро- и наносистемной технике", Москва.- Зеленоград.- 2011г.

Медетов Н. А., Карташов Д. А., Смирнов Д. И., Орлов Р. С. Компьютерные методы обработки результатов рентгеновского анализа наноразмерных структур // Тезисы докладов конференции "Рентгеновское, синхротронное излучения, нейтроны и электроны для исследования наносистем и наноматериалов. Нано-Био-Инфо-Когнитивные технологии - 2011".- Москва.- 2011г.- с. 549

Карташов Д. А. Методика численной оценки параметров интерфейса многослойных структур Mo/Si на основе данных относительной рентгеновской рефлектометрии // Тезисы докладов XIV-й международной конференции DSPA-2012 "Цифровая обработка сигналов и её применение".- Москва.- 2012г.

Карташов Д. А. Повышение эффективности вычислений результатов двухволновой рентгеновской рефлектометрии многослойных структур при использовании графических процессоров и технологии CUDA // VIII Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современных наук".- Новости информационных технологий, Пльзень.- Польша.- 2012.-с.67

Ермаков А.С., Карташов Д.А., Рябова Л.В. Проблемы токов утечки в подзатворных МДП системах. Тезисы докладов конференции "Микроэлектроника и Информатика - 2013".- Зеленоград, 2013;

Карташов Д.А. Исследование и оптимизация параметров метода роя частиц для минимизации многомерных функций. Тезисы докладов конференции "Микроэлектроника и Информатика - 2014".- Зеленоград, 2014

Погалов А.И., Угольников С.В., Карташов Д.А. Конструкторско-технологические расчёты экранирования блоков электронной аппаратуры. Научно-практическая конференция преподавателей "Практика внедрения интерактивных технологий в учебный процесс НИУ МИЭТ". Тезисы докладов. – М.: МИЭТ, 2016.- С. 183-184. ISBN 978-5-7256-0840-3.

Бардушкин В.В., Сычев А.П., Кочетыгов А.А., Карташов Д.А. Моделирование эксплуатационных упругих свойств капсулированных трибокомпозитов с учетом разброса значений относительных размеров микрокапсул. // ВЕСТНИК ЮЖНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН, стр. 5–10, 2018. Т.19. №12/221 С. 552-557.

Сычев А.П., Бардушкин В.В., Сычев А.А., Карташов Д.А. Способ получения фрикционных полимерных материалов // Межд. научно-практ. конф. «Транспорт: наука, образование, производство» («Транспорт-2020»), 20-22 апреля 2020 г. // – Ростов-на-Дону: РГУПС, т. 1 («Технические науки»), 497 с. С. 343–347.

Карташов Д.А. Исследование влияния периода генерируемого при помощи звуковой карты сигнала на его форму // Прикладная математика и анализ данных : сборник трудов Межвузовского круглого стола, 31 октября 2022 г. (сессия 1), 30 ноября 2022 г. (сессия 2), г. Москва / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т. ; под ред. В. Ю. Сеницына, В. М. Максимова. — Казань : Бук, 2022. — 178 с. — Текст : непосредственный. С. 10-13.

Карташов Д.А. Особенности исследования жидких образцов методом ЭПР // Метрология физико-химических измерений: тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции, 05-08 сентября 2023 г, - Менделеево: ФГУП «ВНИИФТРИ», 2023.-215 с. С. 67-68.

Карташов Д.А.Современные подходы к обнаружению и противодействию беспилотным летательным аппаратам: проблемы и перспективы // Взаимодействие вузов, научных организаций и учреждений культуры в сфере защиты информации и технологий безопасности: Сборник статей по материалам V Международной научной конференции, посвящённой памяти доктора технических наук, профессора А.А. Тарасова и доктора технических наук, старшего научного сотрудника О.В. Казарина. Москва, 24–26 апреля 2024 г. / Под ред. Д.А. Митюшина. М.: РГГУ, 2024.- 286 с. С. 99-103.

Карташов Д.А. Использование технологии параллельных вычислений CUDA в расчётных задачах // Вопросы оптимизации социотехнических систем: сборник докладов межвузовских круглых столов (г. Москва, 2024 г.) / сост. А.Б. Клименко; Ин-т информац. наук и технологий безопасности, Рос. гос. гуманит. ун-т. — Казань: Бук, 2024.—106 с. — Текст : непосредственный. С. 84-87.